



Adlershof. Science at Work.

Tagungsbeiträge / Anmeldung

Die Anmeldung zur PRORA 2019 erfolgt ausschließlich über das Onlineformular auf iap-adlershof.de

Bitte reichen Sie Ihre Abstracts zu Postern bis zum 1. November 2019 ein.

Sie haben die Möglichkeit, im Abstract-Book eine Anzeige zu schalten. Andere Unterstützung und Sponsoring sind gern willkommen. Sprechen Sie dazu mit unserem Organisationsteam.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Teilnahmekosten

Regulär 250,00 € / Studenten 45,00 €

Die Buchung von Hotelzimmern ist bis zum 1.11.2019 zum Vorzugspreis möglich (siehe Tabelle).

	Dorint Adlershof	airporthotel Adlershof
Einzelzimmer	99,00 € / Nacht	75,00 € / Nacht
Doppelzimmer	117,00 € / Nacht	94,00 € / Nacht
Frühstück	inklusive	13,00 € / Person

Rahmenveranstaltung

Besonders hingewiesen wird auf das Satellite-Meeting des Berlin Laboratory for X-ray Technologies (BLIX) und das anschließende Stiftertreffen an der TU Berlin am 27.11.2019.

Organisation und Korrespondenzanschrift

Valentina Gorny (Organisation)
Tel.: (030) 63 92-65 09
IAP Institut für angewandte Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31
12489 Berlin
E-Mail: info@iap-adlershof.de

Veranstalter

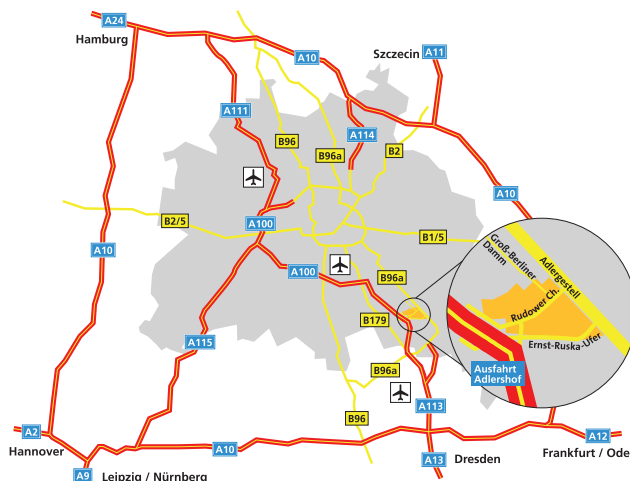
IAP – Institut für angewandte Photonik e.V., Berlin
BAM – Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Bruker Nano GmbH, Berlin
Helmut Fischer Stiftung, Stuttgart
OpTecBB – OpTec-Berlin-Brandenburg e.V.
PTB – Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin
Arbeitskreis Prozessanalytik
SPECTRO Analytical Instruments GmbH, Kleve
TU – Technische Universität Berlin
WISTA Management GmbH
Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

PRORA® ist eine eingetragene Marke des IAP e.V.

Anfahrtsskizzen auch unter www.adlershof.de

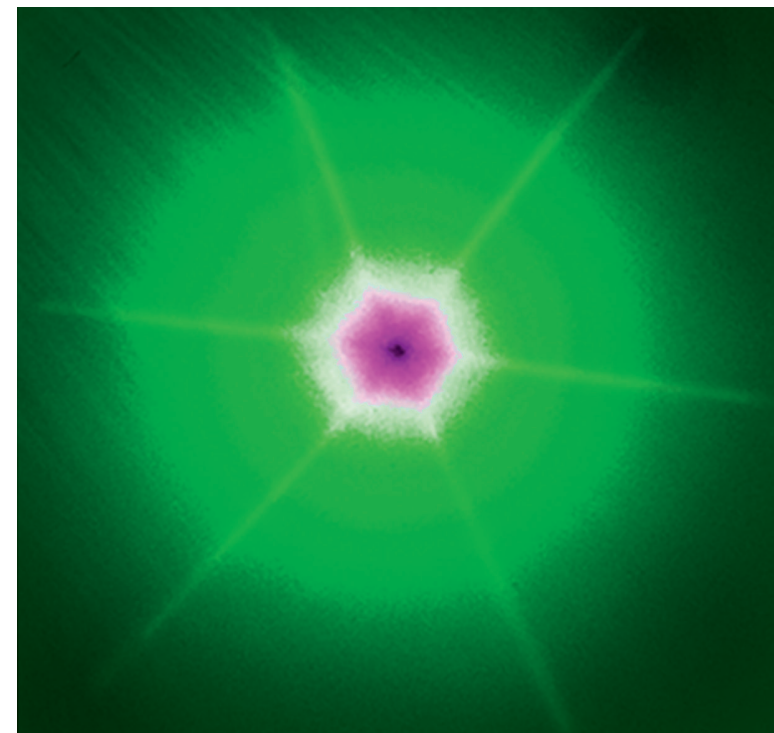
Programmkomitee

W. Babel, Helmut-Fischer GmbH, Standort Sindelfingen
B. Beckhoff, PTB, Berlin
S. Bjeoumikhova, Helmut-Fischer GmbH, Standort Berlin
O. Boslau, Bruker Nano GmbH, Berlin
A. Erko, IAP e.V., Berlin
E. Gerndt, Bruker AXS GmbH, Karlsruhe
B. Kanngießer, TU Berlin
M. Krumrey, PTB, Berlin
N. Langhoff, IAP e.V., Berlin
F. Lerch, OpTecBB, Berlin
H. Miersch, SPECTRO Analytical Instruments GmbH, Kleve
M. Ostermann, BAM, Berlin
U. Panne, BAM und HU Berlin
P. U. Pennartz, Rigaku Innovative Technologies, Neu-Isenburg
T. Schüle, Bruker Nano GmbH, Berlin
Ch. Seifert, IAP e.V. Berlin
F. Siewert, HZB BESSY II, Berlin
H. Stiel, MBI, Berlin
R. Wedell, IAP e.V., Berlin
J. Wiesmann, Incoatec GmbH, Geesthacht



Programm

10. Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik



28. – 29. November 2019

Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof / Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
Richard-Willstätter-Straße 11 · 12489 Berlin



DO
28
NOV

09:00 **Anmeldung**

10:00 **Eröffnung**

M. Krumrey (PTB)
F. Lerch (OptecBB)
Ch. Seifert (IAP e.V.)

Methodische Herausforderungen

Leitung: Ch. Seifert

10:20 A. Erko (IAP e.V.) (E)

Novel Laboratory Soft X-ray Spectrometers and Monochromators

10:50 S. Praetz (TU Berlin)

Application of Laboratory-XAFS

11:10 R. Schramm (Fluxana GmbH & Co. KG)

Universal Fusion Method for Recycling Samples containing Metals and Oxides

11:30 A. Wählich (PTB)

Quantifying thin layered alloys with a reliable uncertainty budget using synchrotron radiation based experiments

11:50 R. Unterumsberger (PTB)

Characterization of samples for Total Reflection X-ray Fluorescence analysis with reference-free quantification

12:10 Mittagspause

Applikationen in der Industrie

Leitung: B. Beckhoff

13:10 A. D. Renno (Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology at HZDR) (E)

Applications in the Resource Industry – Between Handheld Instruments and 4D Methods

13:40 E. Blokhina (Bruker Nano GmbH)

Thin passivation layers: which measurement system is optimal?

14:00 C. Zech (PTB)

Unraveling Degradation Effects in Lithium-Ion Batteries with X-ray Spectrometry Techniques

14:20 A. Nutsch (Helmut Fischer GmbH, Sindelfingen)

Dünne metallische Schichten und Legierungsschichten als Standards (DAkK/ISO 17025) für die Röntgenfluoreszenzanalyse

14:40 Kaffeepause

Neue röntgenanalytische Methoden

Leitung: B. Kanngießner

15:10 Chr. Strelt (Atominstitut TU Wien) (E)

Characterization of nanomaterials with combined GIXRF with XRR using lab sources

15:40 P. Hönicke (PTB)

Characterization of the geometrical parameters of a Bruker S4 T-STAR instrument for advanced in-lab grazing incidence X-ray fluorescence analysis

16:00 B. Arlt (Anton Paar Germany GmbH)

Relating Nanostructure to Macroscopic Properties Using a Laboratory Rheo-SAXS Setup

16:20 B. Pollakowski-Herrmann (BAM)

Traceable and reliable chemical analysis of aerosols by X-ray spectrometry

16:40 J. Probst (NOB GmbH)

A laboratory soft X-ray reflectometer based on a multi-spectral fluorescence micro-source

17:00 Firmenpräsentationen

17:45 Postersession und Rundgang durch die Firmenausstellung

19:00 Verleihung des Helmut-Fischer-Posterpreises

19:30 Gemeinsames Abendessen

Applikationen in der Industrie

Leitung: H. Miersch

08:30 V. Hamelbeck (SPECTRO Analytical Instruments GmbH) (E)

Anforderungen an die Analyse von Biokraftstoffen: Matrixkorrektur durch direkte Bestimmung des Sauerstoffgehalts zur genauen Analyse von Schwefel und weiteren Spurenelementen

09:00 J. Vogelsang (PS Plastics-Support Ingenieur- und Sachverständigenbüro) (E)

RFA-Untersuchungen an EPS- und XPS-Abfällen aus dem Verpackungs- bzw. Baubereich: Extraktion der Flammenschutzmittel und Brom-Messungen zu deren Nachweis/Unterscheidung

09:30 M. Glaum (Helmut Fischer GmbH, Sindelfingen)

Automatisierte XRF-Messungen und Anwendungen in der Praxis

09:50 M. Boin (HZB)

Materials Research in the hard X-ray Range under Laboratory Conditions: Exploitation of the Properties of High-Flux Metaljet Sources

FR
29
NOV

10:10 M. Bügler (Bruker Nano GmbH)

M4 TORNADOPlus – micro-XRF going Organic

10:30 P. Wobruschek (Atominstitut TU Wien)

Analysis of trace elements in airborne particulate matter with TXRF directly sampled on reflectors

10:50 Kaffeepause

Neue Entwicklungen bei Komponenten für prozessanalytische Geräte

Leitung: O. Boslau

11:20 B. Nensel (CrossRoads Scientific) (E)

Quantifizierung in der Röntgenanalytik: Welche Herausforderungen ergeben sich durch neue Entwicklungen bei den Komponenten?

11:50 St. Staeck (TU Berlin)

Investigating the use of CMOS detectors in the soft X-ray range

12:10 A. Pahlke (KETEK GmbH)

Silizium Drift Detektoren und Ausleseelektronik der neuesten Generation

12:30 Mittagspause

Neue Entwicklungen bei Komponenten für prozessanalytische Geräte

Leitung: F. Siewert

13:30 A. Kubec (Paul Scherrer Institut)

A path towards next generation X-ray gratings: Compensation of substrate errors by a local variation of the grating pitch

13:50 A. Sokolov (HZB)

Design, fabrication and characterization of highly efficient multilayer blazed gratings for the tender X-ray region

14:10 A. Borowski (NOB GmbH)

Vector-Scan Ionenätztechnik zur Herstellung von 3-dimensionalen VLS-Gitterstrukturen

14:30 A. Schlemminger (Secopta analytics GmbH)

Is competition good for business? How the laser increasingly substitutes established technologies in in-line and at-line analysis

14:50 M. Wansleben (HZB)

Anwendung eines effizienten Doppelkristall-von Hamos-Spektrometers für die hochauflösende Emissionsspektrometrie

15:10 **Schlusswort**

R. Wedell